

CONVOCATORIA DE BECA FORMATIVA EN EL SERVICIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE RAYOS X

En el ámbito de actividades de los Servicios Generales de Investigación (SGI) de la Universidad de Sevilla, este Vicerrectorado de Investigación convoca una Beca Formativa en Técnicas de Caracterización del SGI Laboratorio de Rayos X, de acuerdo con las siguientes bases,

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera: Objetivos. Las Becas tienen como objeto la formación de personal cualificado en técnicas analíticas y de caracterización del SGI Laboratorio de Rayos X de la Universidad de Sevilla. Se convoca una beca para la siguiente área específica:

Servicio General de Investigación Laboratorio de Rayos X

Segunda: Beneficiarios. Podrán solicitar esta beca quienes reúnan los siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes:

- a) Tener residencia legal en España.
- b) Estar en posesión de un título universitario superior en algunas de las siguientes titulaciones Física, Química, Ingeniería de Materiales, Farmacia, Geología, siendo el año de obtención del título con una antigüedad como máximo de dos años anteriores de la convocatoria de la beca de formación.

No serán elegibles para estas becas las personas que hayan disfrutado con anterioridad de Becas de Formación en los SGI o cualquier otra beca con la misma finalidad que la convocada.

Tercera: Dotación. La Beca comprende una asignación mensual de **800 euros**. El disfrute de la Beca será incompatible con la percepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada por el Vicerrector de Investigación. A este importe procede practicar la retención de IRPF que legalmente corresponda al estar sujeta dicha suma al impuesto señalado conforme establece el artículo 17.2 de la Ley 35/2006 e igualmente deberá retenerse la cuota de Seguridad Social correspondiente al ser aplicable igualmente las previsiones contenidas en el RD 1493/2011.

Cuarta: Carácter de las Becas. La Beca no supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad de Sevilla.

Quinta: Duración. La duración de las becas será de **dieciocho meses** contados desde la fecha de incorporación, que será determinada por el Director de los SGI, de acuerdo con el Responsable Científico de cada Servicio. Durante los periodos vacacionales no se disfrutará de la beca,



reanudándose ésta al acabar dicho periodo vacacional. Dichos periodos vacacionales no computarán como parte de los dieciocho meses de formación.

Sexta: Dedicación. El período de formación será de **25 horas semanales**, ajustándose al régimen de horario establecido por el Responsable Científico del Servicio, de acuerdo con el Director de los SGI.

Séptima: Condiciones de disfrute y obligaciones del becario.

a) El disfrute de la beca se realizará en el Servicio General de Investigación Laboratorio de Rayos X, y comenzará al incorporarse la persona seleccionada al Servicio asignado en la fecha fijada de acuerdo con la Base Quinta. La no incorporación en dicha fecha se entenderá como renuncia a la beca.

b) La aceptación de la beca por parte del beneficiario implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las determinadas por el Responsable Científico del Servicio al que se asigne, de acuerdo con el Director de los SGI, debiendo cumplir el horario, lugar de desarrollo de formación e indicaciones de desempeño de la misma.

c) Durante el desarrollo de la beca, el Responsable Científico del Servicio podrá elevar al Director de los SGI informes relativos al aprovechamiento y cumplimiento de obligaciones por parte del becario. Un informe negativo podrá suponer la extinción del derecho de disfrute de la beca. En todo caso, a la finalización del periodo de disfrute de la beca, el Responsable Científico del Servicio elevará al Director de los SGI un informe final sobre los aspectos antes mencionados.

Octava: Solicitudes y documentación. Sólo se aceptará una solicitud por persona y convocatoria, que habrá de seleccionar sólo un área para su evaluación, en caso de haber varias. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo modelo figura en el Anexo I, serán dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrector Investigación de la Universidad de Sevilla, y se presentarán en la Administración del CITIUS.

Se debe adjuntar la siguiente documentación:

- a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o documento equivalente.
- b) Certificación académica personal completa.
- c) Curriculum vitae del solicitante, con las debidas acreditaciones de los méritos expuestos.

Novena: Selección y valoración de las solicitudes. La selección se realizará por una comisión nombrada por el Vicerrector de Investigación, que tendrá en cuenta los aspectos indicados en el baremo del Anexo II.

Adicionalmente, la Comisión podrá concertar entrevistas con algunos candidatos/as durante el proceso de selección.



Décima: Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se podrán presentar hasta el **día 20 de junio de 2012**. El impreso de solicitud podrá retirarse en la Administración de los SGI o descargarse de la sección anuncios de la página web del Centro (<http://investigacion.us.es/scisi/sgi/anuncios-incidencias>).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación. No obstante y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJAP/PAC.

Sevilla, 4 de junio de 2012

EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN



BECAS FORMATIVAS

ANEXO I

CONVOCATORIA DE BECA FORMATIVA DEL SERVICIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE RAYOS X

(Convocatoria de 4 de junio de 2012)

DATOS PERSONALES					
Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombre	
DNI/Pasaporte		Nacionalidad		Fecha Nacimiento	
Dirección Postal					
Ciudad		Código Postal		Provincia	
CONTACTO					
Correo Electrónico		Teléfono Móvil		Telefono Fijo	
Licenciatura/Ingeniería:			Fecha Obtención:		
ÁREAS (seleccionar sólo una)					
Laborario de Rayos X		Fototeca			
OBSERVACIONES					

Fdo. El Interesado

Fecha:

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD DE SEVILLA



ANEXO II

CONVOCATORIA DE BECA FORMATIVA DE LOS SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE RAYOS X

(Convocatoria de 4 de junio de 2012)

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES

A) FORMACIÓN ACADÉMICA

* Hasta 6 puntos

**B) CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD
FORMATIVA**

* Hasta 4 puntos

C) CONOCIMIENTOS ACREDITADOS DE INFORMÁTICA E IDIOMAS

* Hasta 2 puntos

D) OTROS MÉRITOS

* Hasta 4 puntos



BECAS FORMATIVAS

ANEXO III

CONVOCATORIA DE BECA FORMATIVA EN TÉCNICAS ANALÍTICAS Y DE CARACTERIZACIÓN DEL SGI LABORATORIO DE RAYOS X (CITIUS) (Convocatoria de 4 de junio de 2012)

PLAN FORMATIVO

TUTORA ACADÉMICA: Dra. Patricia Aparicio Fernández, Profesora Titular de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla y Directora del SGI Laboratorio de Rayos X del CITIUS

TUTORES TÉCNICOS: D. Santiago Medina Carrasco y D. Alberto Ortega Galván, ambos con la categoría de Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación

OBJETO DE LA BECA FORMATIVA: Proporcionar al becario/ha seleccionado/a formación en técnicas de caracterización por difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X de materiales, de forma complementaria el becario/ha seleccionado/a recibirá formación sobre el sistema de calidad implantado en el CITIUS.

El becario/ha seleccionado/a recibirá formación sobre:

- a) el fundamento de las técnicas de difracción (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX) disponibles en el SGI-LRX
- b) la preparación, montaje y medida de muestras para DRX y FRX
- c) Interpretación de espectros de FRX y cálculo de errores/incertidumbres de las medidas
- d) Interpretación de diagramas de DRX: Análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas, microdifracción, tensión residual y stress, alta resolución, reflectometría, mapeo de espacio recíproco, difracción de Rayos X a incidencia rasante en plano (IP-GID), dispersión de Rayos X a bajo ángulo e incidencia rasante (GI-SAXS), tensión residual y estrés, análisis de textura, análisis mediante capilares y micro-difracción.
- e) Funcionamiento del Sistema de Calidad de los SGI y realización de Procedimientos Normalizados de Trabajo dentro del Sistema de Calidad de los SGI.



El cronograma temporal de la formación y la distribución teórico-práctica será la siguiente:

	Meses																	
a) Fundamento Teórico en DRX y FRX (100% Teoría) Meses 1-2	■	■																
b) Preparación muestras DRX y FRX (100% Práctica) Meses 1-4	■	■	■	■														
c) Interpretación espectros FRX y cálculo errores (10% Teoría/90% Práctica) Meses 5-10					■	■	■	■	■	■								
d) Interpretación DRX (10% Teoría/90% Práctica) Meses 5-18					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
e) Funcionamiento Sistema de Calidad SGI (10% Teoría/90% Práctica) Meses 3-18			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Dado que se trata de una beca formativa, durante la duración de la beca, será requisito que el becario/ha seleccionado/a se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:

- a) Realizando sus Tesis Doctoral, parte de la cual debe de estar basado en técnicas de DRX y FRX.
- b) Matriculado en un Máster y/o realizando el trabajo de fin de Máster, parte del cual debe de estar basado en técnicas de DRX y FRX.

El becario/a seleccionado tendrá que demostrar alguna de dichas condiciones en un plazo máximo de 6 meses de disfrute de la beca, ya que el incumplimiento de esta condición supondría la extinción del derecho de disfrute de la beca.

Será obligación del tutor académico, supervisar la formación del becario no sólo en relación con el aprendizaje de las técnicas basadas en rayos X, sino en la incorporación de las mismas a los citados trabajos de formación investigadora.

DURACIÓN DE LA BECA: 18 meses, dado que es el tiempo que se estima necesario para que pueda aprender las técnicas y aplicarlas a un trabajo de investigación.

